## 第六章 半导体中载流子的输运

- 6.1 载流子的漂移运动
- 6.2 载流子的散射
- 6.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
- 6.4 强电场下的输运

### 6.3.1 迁移率与杂质浓度和温度的关系

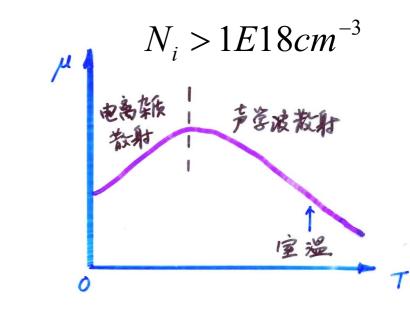
几种散射机构同时存在时,  $P = P_I + P_{II} + P_{III} + \dots$ 

掺杂Si, Ge:

电离杂质散射
$$\mu_i = \frac{q}{m^*} \frac{T^{3/2}}{BN_i}$$

声学波散射 
$$\mu_s = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2}}$$

$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$



### 6.3.1 迁移率与杂质浓度和温度的关系

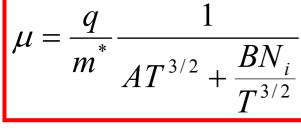
室温(300 K)下,高纯 Si、Ge、GaAs 的迁移率

 海μη (cm²/V·s)
 μρ (cm²/V·s)

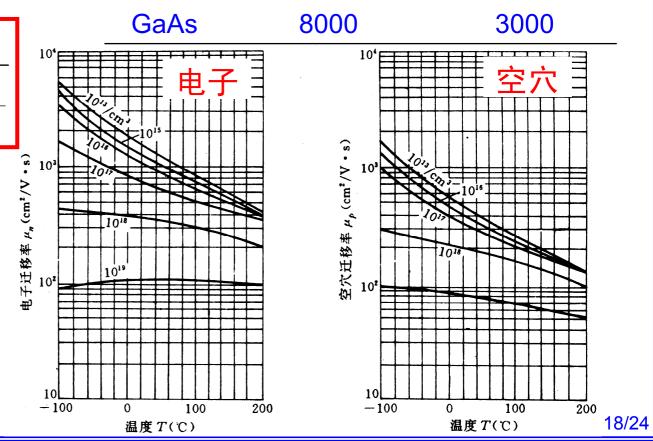
 Si
 1350
 500

 Ge
 3900
 1900

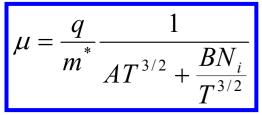
 GaAs
 8000
 3000



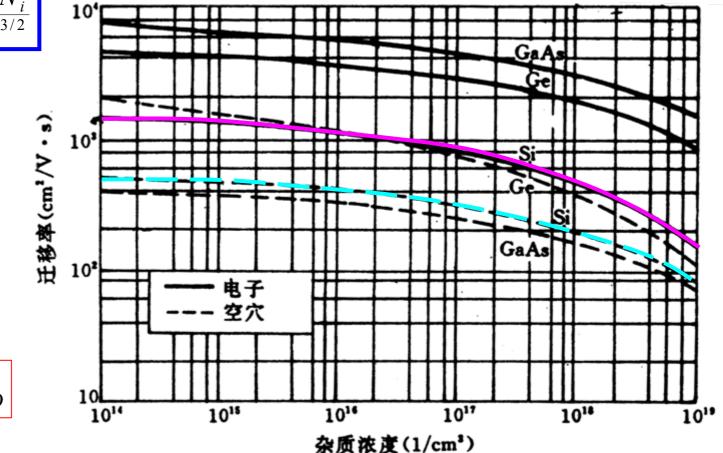
Si 迁移率随温 度的变化关系



### 6.3.1 迁移率与杂质浓度和温度的关系



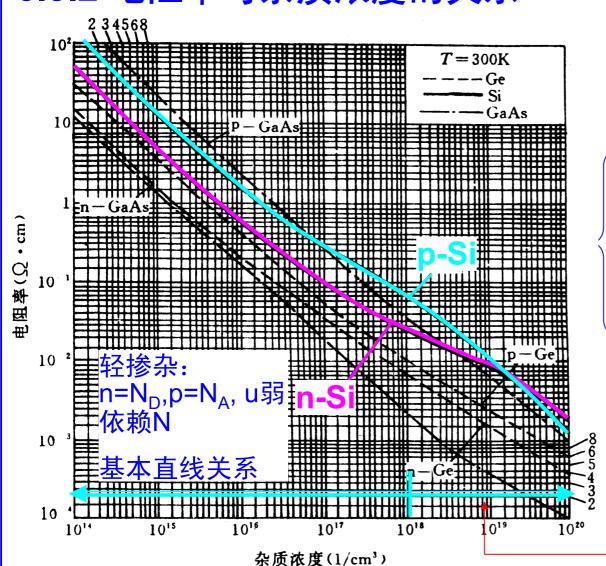
迁移率随杂质浓度的变化关系(实线:电子,虚线:空穴)



### 补偿半导体

$$N_i = N_A + N_D$$

### 6.3.2 电阻率与杂质浓度的关系



$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$$

p型 
$$\rho = \frac{1}{nq\mu_n}$$
p型  $\rho = \frac{1}{pq\mu_p}$ 
本征  $\rho_i = \frac{1}{qn_i(\mu_n + \mu_p)}$ 

重掺杂:不完全电 离; N增加,u减小

偏离直线关系

### 6.3.2 电阻率与温度的关系

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$$

杂质半导体

杂质电离1

本征激发2

迁移率因素

载流子来源

电离杂质散射3

晶格散射4

•	本征半 导体 一主要由n <sub>i</sub> 决定, 单调下降	ρ
1	杂质半 A 导体 B 室温	T

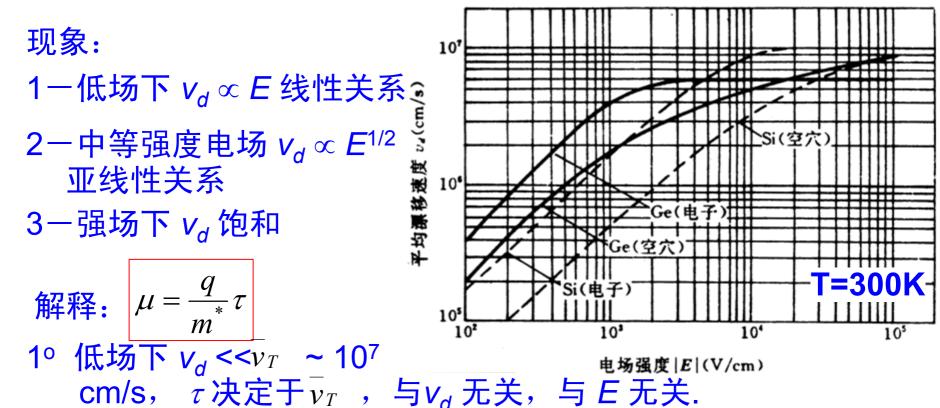
	载流子变化		迁移率变化	
	1	2	3	4
AB	随T增加	忽略	随T增加	忽略
BC	全电离	次要	次要	随T降低
CD	次要	随T增加	次要	次要

## 第六章 半导体中载流子的输运

- 6.1 载流子的漂移运动
- 6.2 载流子的散射
- 6.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
- 6.4 强电场下的输运

## 6.4 强电场下的输运1

### 6.4.1 欧姆定律的偏离和热载流子



2° 中场下( $E \ge 10^{3\sim 4} \text{ V/cm}$ ) $v_d \sim v_T \tau$ 决定于 $v_T \approx v_d$ ,

$$E \uparrow \tau \downarrow \mu \downarrow$$

3°强场下,发射光学声子成为动量驰豫和能量驰豫的主要机制, 速度可以饱和 23/24

## 6.4 强电场下的输运2

### 6.4.1 欧姆定律的偏离和热载流子

强场下载流子的平均动能明显高于热平衡时的值 —— 热载流子

- 1° 热载流子受电离杂质散射弱,但声子散射(特别是光学声子)可以很强;
- 2° 热载流子可以在等价或不等价能谷间转移.

# 半导体物理

主讲人: 蒋玉龙

微电子学楼312室,65643768

Email: yljiang@fudan.edu.cn

http://10.14.3.121

## 第七章 非平衡载流子

- 7.1 非平衡载流子的注入与复合
- 7.2 准费米能级
- 7.3 复合理论
- 7.4 陷阱效应
- 7.5 载流子的扩散运动
- 7.6 载流子的漂移运动、双极扩散
- 7.7 连续性方程

### 7.1.1 非平衡载流子的产生

大注入  $\Delta n$  (或  $\Delta p$ ) >>  $(n_0 + p_0)$ 

一平衡载流子浓度 在热平衡状态下的载流子浓度  $n_0, p_0$ 

3/58

### 7.1.1 非平衡载流子的产生

### 小注入的例子

一非平衡少数载流子更重要

小注入 n型 
$$p_0 << \Delta n << n_0 \Rightarrow$$
 
$$\begin{cases} n \approx n_0 \\ p = \Delta p \end{cases}$$

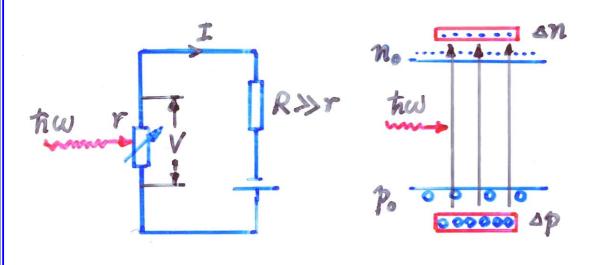
例:掺杂浓度 $N_D = 1.5 \times 10^{15} cm^{-3}$ 的n型半导体硅

$$n_0 = 1.5 \times 10^{15} cm^{-3}$$
  $p_0 = n_i^2 / n_0 = 1.5 \times 10^5 cm^{-3}$   $\Delta n = \Delta p = 10^{10} cm^{-3}$ 

$$n = n_0 + \Delta n \approx n_0 = 1.5 \times 10^{15} cm^{-3}$$
  $p = p_0 + \Delta p \approx \Delta p = 10^{10} cm^{-3}$ 

### 7.1.2 附加光电导现象

附加光电导



$$\Delta p = \Delta n$$

$$\downarrow$$

$$\Delta \sigma = \Delta p q (\mu_n + \mu_p)$$

$$\downarrow$$

$$V = Ir = I \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}$$

$$\Delta V = I \frac{l}{S} \left( -\frac{\Delta \sigma}{\sigma_0^2} \right)$$

$$\Delta V \propto \Delta p$$

#### 间接检验非平衡少子的注入

### 7.1.3 非平衡载流子的复合 $p = p_0 + \Delta p \Rightarrow p_0$

问题:外界注入撤消后,非平衡载流子怎么变化? ——复合

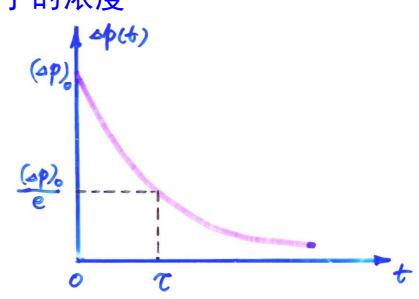
设 
$$t = 0$$
 时  $\Delta p = (\Delta p)_0$ 

P——非平衡载流子的复合几率(单位时间内非平衡载流子被复合掉的几率)(小注入条件下,P为常数)

$$\Delta p(t)$$
 —— 在  $t$  时刻非平衡载流子的浓度

$$\frac{d\Delta p(t)}{dt} = -P \cdot \Delta p(t)$$
$$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 \exp(-Pt)$$
$$\tau = \frac{1}{-P}$$

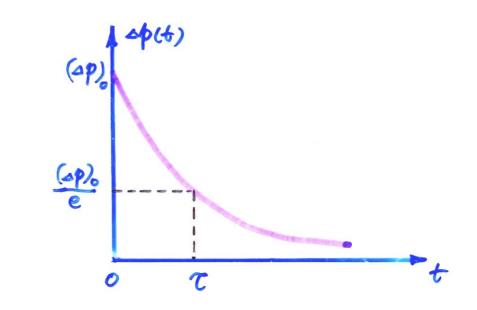
则 
$$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 \exp(-t/\tau)$$



### 7.1.3 非平衡载流子的复合

$$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 \exp(-t/\tau)$$

复合率 
$$\left| \frac{d\Delta p(t)}{dt} \right| = \frac{\Delta p(t)}{\tau}$$



### 非平衡载流子的平均寿命

$$\bar{t} = \frac{\int_0^\infty t d\Delta p(t)}{\int_0^\infty d\Delta p(t)} = \tau$$

$$\tau = \frac{1}{P}$$